**利用設備追加届**

　　　年　　月　　日

分子科学研究所 機器センター長　殿

所　属

氏　名

［申請年度］　　　　　　　年度　（　通年　・　前期　・　後期　）

［申請番号］

［新たに利用希望する設備名］

□電子顕微鏡　電界放出形走査電子顕微鏡(SEM)/JEOL JSM-6700F

□　〃　　低真空分析走査電子顕微鏡（低SEM）/Hitachi SU6600

□　〃　　電界放出形透過電子顕微鏡(TEM)/JEOL JEM-2100F

□Ｘ線　単結晶Ｘ線回折/Rigaku MERCURY CCD-1・R-AXIS IV

□　〃　　単結晶Ｘ線回折/Rigaku MERCURY CCD-2

□　〃　　単結晶Ｘ線回折（微小結晶用）/Rigaku HyPix-AFC

□　〃　　粉末Ｘ線回折/Rigaku RINT-UltimaⅢ

□　〃　　オペランド多目的Ｘ線回析/Malvern Panalytical EMPYREAN（要担当者事前確認）

□　〃　　Ｘ線溶液散乱計測システム/Rigaku NANO-Viewer

□電子分光　機能性材料バンド構造顕微分析システム VG SCIENTA DA30

□　〃　　Ｘ線光電子分光/VG SCIENTA R4000L1, MX-650

□電子スピン共鳴　ESR/Bruker E680（要担当者事前確認）

□　〃　　ESR/Bruker EMX Plus

□　〃　　ESR/Bruker E500

□SQUID　SQUID型磁化測定装置/Quantum Design MPMS-7

□　〃　　SQUID型磁化測定装置/Quantum Design MPMS-XL7

□熱分析　示差走査型カロリメーター（溶液）/MicroCal VP-DSC

□　〃　　等温滴定型カロリメーター（溶液）/MicroCal PEAQ-ITC

□　〃　　等温滴定型カロリメーター（溶液）/MicroCal iTC200

□　〃　　熱分析装置（固体・粉末）/Rigaku DSC8231/TG-DTA8122

□質量分析　MALDI-TOF質量分析/Bruker Microflex LRF

□分光　顕微ラマン分光/RENISHAW in Via Reflex

□　〃　　FT遠赤外分光/Bruker IFS66v

□　〃　　蛍光分光/HORIBA SPEX Fluorolog3-21

□　〃　　紫外・可視・近赤外分光光度計/Shimadzu UV-3600Plus

□　〃　　絶対PL量子収率測定装置/HAMAMATSU Quantaurus-QY C11347-01

□　〃　　円二色性分散/JASCO J-1500

□レーザー　ピコ秒レーザー/Spectra-Physics,Quantronix Millennia-Tsunami,TITAN-TOPAS

□高磁場NMR　1H 800MHz/Bruker [AVANCE800](http://nanoims.ims.ac.jp/ims/supports25_nmr800.html)US

□　〃　　1H 600MHz固体/Bruker [AVANCE600](http://nanoims.ims.ac.jp/ims/supports25_nmr600.html)

|  |  |
| --- | --- |
| センター長 | 設備担当者 |
|  |  |

□　〃　　1H 600MHz溶液/JEOL JNM-ECA600